

Raster-Elektronenmikroskopie

- Modernes Raster-Elektronenmikroskop LEO1430
- Vergrößerungen um 300'000:1 möglich
- 2 erfahrene Operatoren
- Energiedispersive Röntgenanalyse (EDX)
- Topographie- und Elementkontrast

Nutzungsmöglichkeiten

Dokumentationsaufgaben

Bildauflösung nach Kundenvorgabe. Klar definierte Dokumentationsaufgaben, z.B. für feine Pulver, Elektronikbauteile oder Oberflächen.

Stundensatz 175.- CHF

Engineering

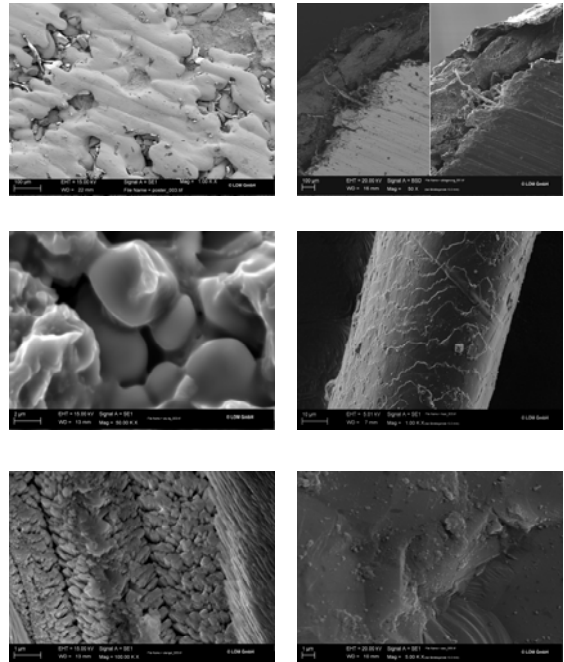
Untersuchungen von Bruchflächen und Oberflächen mit komplexen Fragestellungen. Rückstandsanalysen, Charakterisierungen, etc.

Stundensatz 250.- CHF

Vermietung

Unser REM ist jederzeit problemlos zugänglich. Informieren Sie sich! Wir machen Ihnen ein Angebot für die Vermietung inkl. Instruktion Ihrer Mitarbeiter.

Außerdem bieten wir Grundausbildungen und Schulungen für Ihr REM an.



Technische Daten:

- Auflösung 3.5 nm
- Vergrößerungen 15:1 bis 300'000:1
- SE (Sekundärelektronen) Detektor
- BSE (Rückstreuelektronen) Detektor
- Spezielle Modi für schlecht leitende Proben
- Bildauflösung max. 3072 x 2304
- Vakuumkanter 300 x 265 x 190 mm
- 5 Achsen Steuerung und Kippwinkel bis 90°
- Tischbelastung bis 2 kg

